# PATENT COOPERATION TREATY

To:

C	41	MITTER			DIIDE	A I I
-rom	THE	INIE	KIVA I	ΙΙΟΝΔΙ	. BURE	411

# **PCT**

### **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

NIEDERNOSTHEIDE, Franz, Josef et al

Commissioner
US Department of Commerce
United States Patent and Trademark
Office, PCT
2011 South Clark Place Room
CP2/5C24
Arlington, VA 22202
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year)

16 August 2001 (16.08.01)

International application No.

PCT/DE00/03351

International filing date (day/month/year)

26 September 2000 (26.09.00)

Applicant

Priority date (day/month/year)

30 September 1999 (30.09.99)

Applicant

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	15 March 2001 (15.03.01)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

Antonia Muller

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

2.			
	·		

# Translation

PATENT COOPERATION TREATY

**PCT** 

10/089,590

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference 1999P08125WO	FOR FURTHER ACTION Preliming	otification of Transmittal of International ary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)		
International application No.	International filing date (day/month/year	Priority date (day/month/year)		
PCT/DE00/03351	26 September 2000 (26.09.00)	30 September 1999 (30.09.99)		
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC H01L 29/74				
Applicant	SIEMENS AKTIENGESELLSCHA	AFT		
<ol> <li>This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.</li> </ol>				
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, including this cov	er sheet.		
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).  These annexes consist of a total of sheets.				
I Basis of the report		CEIVED P -9 2002 P -9 2002		
II Priority 2800				
III Non-establishmen	t of opinion with regard to novelty, inventi	ve step and industrial applicability		
IV Lack of unity of in				
V Reasoned statemen citations and expla	nt under Article 35(2) with regard to novel anations supporting such statement	ty, inventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents	s cited			
VII Certain defects in	the international application			
VIII Certain observatio	ns on the international application			
Date of submission of the demand	Date of completi	on of this report		
15 March 2001 (15.0)	3.01)	4 January 2002 (24.01.2002)		
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authorized office	ег		
Facsimile No.	Telephone No.			

	·	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		/

International application No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

# PCT/DE00/03351

I. Basis of t	I. Basis of the report					
1. This repo	rt has been drawn o	on the basis of (Replacement sheet in this report as "originally filed"	ts which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):			
	the international	application as originally filed.				
	the description,	pages1-14	_, as originally filed,			
		pages	_, filed with the demand,			
}		pages	_, filed with the letter of,			
		pages	_, filed with the letter of			
	the claims,	Nos. 1-6	_ , as originally filed,			
		Nos	, as amended under Article 19,			
		Nos.	_ , filed with the demand,			
		Nos.	, filed with the letter of,			
		Nos.	_ , filed with the letter of			
	the drawings,	sheets/fig1/1	_ , as originally filed,			
		sheets/fig	_ , filed with the demand,			
		sheets/fig	, filed with the letter of,			
		sheets/fig	, filed with the letter of			
2. The amen	dments have result	ed in the cancellation of:	'			
	the description,	pages				
	the claims,	Nos				
	the drawings,	sheets/fig				
			nendments had not been made, since they have been considered by Supplemental Box (Rule 70.2(c)).			
4. Additiona	l observations, if no	ecessary:				
			4			

•	,		
		1	

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/DE 00/03351

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statem	nent			
Nov	elty (N)	Claims	1-6	YES
		Claims		NO
Inve	entive step (IS)	Claims	1-6	YES
		Claims		NO NO
Indu	strial applicability (IA)	Claims	1-6	YES
		Claims	•	NO NO

- 2. Citations and explanations
  - 1. This report makes reference to the following documents:

D1: WO-98/15010

The subject matter of the claims appears to be novel and inventive with respect to the available prior art.

Although D1 discloses a thyristor having transistor amplification reduced by radiation, the document does not render obvious the

- maintenance of the transistor amplification of the driver stage at a level greater than the amplification that is defined below the thyristor cathode by the cathode emitter, cathode base and anode base, or
- maintenance of the transistor amplification of the driver stage at a level greater than the amplification that is defined below the thyristor cathode by the cathode base, anode base and anode emitter, or
- provision of anode short circuits having reduced conductivity below the thyristor cathode.

	· · · · · ·

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/DE 00/03351

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 1. The applicant has not cited any reasons why Claim 1 should not be drafted in the two-part form. Further, the description fails to clearly indicate which features of the subject of Claim 1 are already known from D1; see PCT Guidelines, Chapter III-2.3a.
- Contrary to the requirements of PCT Rule
   (a) (ii), the description neither cites D1 nor indicates the relevant prior art disclosed therein.

**VERIFICATION OF A TRANSLATION** 

I, BARABRA ERNZERHOFF-SNOW, resident of the United States,

residing at 350 Manhattan Ave #3A, New York, N.Y. 10026, depose and state

that:

1. I am familiar with the English and German languages.

2. I have read the attached International Search Report regarding

International patent application no. PCT/DE00/03351.

3. The hereto attached English language text is an accurate

translation thereof.

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge

are true and that all statements made on information and belief are believed to

be true; and further that these statements were made with he knowledge that

willful false statements and the like so made are punishable by fine or

imprisonment, or both, under section 1001 of Title 18 of the United States Code

and that such willful false statements may jeopardize the validity of the

application or any patent issued hereon.

BARABRA ERNZERHOFF-SNOW

Date: September 19, 2002

		X .
	·	
		*

Den

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT DEM GEBIET DES PATENTWESSINS

PCT

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts			Dermittlung des internationalen			
1999P08125W0	VORGEHEN Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit zutreffend, nachstehender Punkt 5					
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(F	rühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)			
PCT/DE 00/03351	26/09/2000		30/09/1999			
Anmelder	i	<del></del>				
CIEMENC ANTIENDECELL COMAET	. 1					
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	et al.					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	e von der Internationalen Recherd ernationalen Büro übermittelt.	chenbehörde erste	ellt und wird dem Anmelder gemäß			
	_	Blätter. icht genannten Un	sterlagen zum Stand der Technik bei.			
1. Grundlage des Berichts						
<ul> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie eing</li> </ul>						
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o		ler Behörde einger	reichten Übersetzung der internationalen			
	n Anmeldung offenbarten <b>Nucleo</b> i equenzprotokolls durchgeführt wo dung in Schriflicher Form enthalte nalen Anmeldung in computerlesl	orden, das en ist.				
bei der Behörde nachträglich	n in schriftlicher Form eingereicht	worden ist.				
1 <del> </del>	in computerlesbarer Form einge					
	träglich eingereichte schriftliche S m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, v		licht über den Offenbarungsgehalt der			
Die Erklärung, daß die in col wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Info	ormationen dem so	chriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,			
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherchierba	r erwiesen (siehe	Feld I).			
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Feld II).					
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfine	iuna					
X wird der vom Anmelder eing						
wurde der Wortlaut von der l	Behörde wie folgt festgesetzt:					
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung	anainka Mindlauk annak mink					
	gel 38.2b) in der in Feld III angege innerhalb eines Monats nach den					
6. Folgende Abbildung der <b>Zeichnungen</b> is	st mit der Zusammenfassung zu v	eröffentlichen: Abb	o. Nr			
wie vom Anmelder vorgesch	-		keine der Abb.			
	ne Abbildung vorgeschlagen hat.					
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichnet.					

		* ;	
	•		

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCI/DE 00/03351

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNG IPK 7 H01L29/74

GENSTANDES

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole )  $IPK \ 7 \ H01L$ 

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, INSPEC

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 98 15010 A (RUFF MARTIN ; EUPEC GMBH & CO KG (DE); SCHULZE HANS JOACHIM (DE)) 9. April 1998 (1998-04-09) Seite 8, Zeile 10 -Seite 11, Zeile 34; Abbildung 3	1-6
A	WO 98 34282 A (SIEMENS AG ;SCHULZE HANS JOACHIM (DE)) 6. August 1998 (1998-08-06) in der Anmeldung erwähnt Abbildung 1/	5

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist  *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
19. Februar 2001	27/02/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	Bevollmächtigter Bediensteter
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Juhl, A

	;	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE 00/03351

rung) ALS WESENTLICH AN CHENE UNTERLAGEN	Betr. Anspruch Nr.
Dezeromung der Veronenmichung, soweit erfordenich unter Angabe der in betracht kommenden Telle	реп. Анаргион Мг.
MITLEHNER H ET AL: "HIGH VOLTAGE THYRISTOR FOR HVDC TRANSMISSION AND STATIC VAR COMPENSATORS" PROCEEDINGS OF THE ANNUAL POWER ELECTRONICS SPECIALISTS CONFERENCE. (PESC),US,NEW YORK, IEEE, Bd. CONF. 19, 11. April 1988 (1988-04-11), Seiten 934-939, XP000044744 ISSN: 0275-9306 in der Anmeldung erwähnt Seite 934, Spalte 1, Absatz 1	6
EP 0 714 139 A (SGS THOMSON MICROELECTRONICS) 29. Mai 1996 (1996-05-29) Abbildung 6	5
	THYRISTOR FOR HVDC TRANSMISSION AND STATIC VAR COMPENSATORS" PROCEEDINGS OF THE ANNUAL POWER ELECTRONICS SPECIALISTS CONFERENCE. (PESC), US, NEW YORK, IEEE, Bd. CONF. 19, 11. April 1988 (1988-04-11), Seiten 934-939, XP000044744 ISSN: 0275-9306 in der Anmeldung erwähnt Seite 934, Spalte 1, Absatz 1  EP 0 714 139 A (SGS THOMSON MICROELECTRONICS) 29. Mai 1996 (1996-05-29)

1

	,	

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/DE 00/03351

Patent document cited in search report	`	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 9815010	A	09-04-1998	DE EP JP	19650762 / 0931351 / 2000503816	A	02-07-1998 28-07-1999 28-03-2000
WO 9834282	Α	06-08-1998	EP	0970525	A	12-01-2000
EP 0714139	Α	29-05-1996	FR JP JP US	2727571 / 2813869 / 8255895 / 5861639 /	B A	31-05-1996 22-10-1998 01-10-1996 19-01-1999

# VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWE S \_\_\_\_\_

# **PCT**

REC'D 2 9 JAN 2002

# INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeiche	n des Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHE		lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
		Internationales Anmeldedatum	(Tag/Monat/ lahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)				
	es Aktenzeichen	26/09/2000	i(rag/wonavoam)	30/09/1999				
PCT/DE0				00/00/1000				
International H01L29/7		nationale Klassifikation und IPK						
.,0,1220,1	•							
Anmelder	_							
SIEMENS	AKTIENGESELLSCHAF	T et al.						
1. Dieser Behöre	Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt.							
		•						
2. Dieser	BERICHT umfaßt insgesar	nt 5 Blätter einschließlich die	ses Deckblatts.					
☐ Ai	ußerdem liegen dem Bericht	ANLAGEN bei; dabei handel ändert wurden und diesem B	it es sich um Blä ericht zuarunde	itter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser				
Be	ehörde vorgenommenen Be	richtigungen (siehe Regel 70.	16 und Abschni	tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).				
	A - 1	mt Plätter						
Diese	Anlagen umfassen insgesa	nt biatter.						
3. Diesei	Bericht enthält Angaben zu	folgenden Punkten:						
		·	•					
l	☐ Grundlage des Berich	ts ,						
11	☐ Priorität		<del></del>	to the state of th				
111	<del>-</del>		minderische i ati	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit				
l iv	☐ MangeInde Einheitlich ☐ Begründete Feststellu		lich der Neuheit	, der erfinderischen Tätigkeit und der				
\ \ \	gewerblichen Anwend	barkeit; Unterlagen und Erklä	irungen zur Stüt	zung dieser Feststellung				
. VI	☐ Bestimmte angeführte	Unterlagen						
VII	☑ Bestimmte Mängel der	r internationalen Anmeldung						
VIII	☐ Bestimmte Bemerkun	gen zur internationalen Anme	eldung					
	·							
L			•					
Datum der I	Einreichung des Antrags	Da	tum der Fertigstelli	ung dieses Berichts				
15/03/200	)1	24.	01.2002					
Name und I	Postanschrift der mit der interna	ionalen vorläufigen Be	vollmächtigter Bed	iensteter icos Mr.				
	auftragten Behörde:		3	and the state of t				
	Europäisches Patentamt - Gits D-10958 Berlin		hl, A	hanse ()				
<i>  [[]</i>	Tel +49 30 25901 - 0	34	, / \	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				

Tel. Nr. +49 30 25901 623





l. Grund	llage	des	В	richts
----------	-------	-----	---	--------

۱.	Auff eing	orderung nach Arti	ndteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine ikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich hm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): 1:
	1-14	1	ursprüngliche Fassung
	Pate	entansprüche, Nr.	:
	1-6		ursprüngliche Fassung
	Zeio	chnungen, Blätter	:
	1/1		ursprüngliche Fassung
2.	die i	internationale Anm	he: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der eldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern chts anderes angegeben ist.
		Bestandteile stand pereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache delt es sich um
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nac
		die Veröffentlichur	ngssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).
			lbersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worder i.2 und/oder 55.3).
3.	Hins inte	sichtlich der in der i rnationale vorläufig	internationalen Anmeldung offenbarten <b>Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz</b> ist die Je Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:
		in der internationa	len Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.
		zusammen mit de	r internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde n	achträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.
		bei der Behörde n	achträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.
		Die Erklärung, dal Offenbarungsgeha	B das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den alt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.
			B die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen entsprechen, wurde vorgelegt.

4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:

	,	

		Beschreibung,	Seiten:							
		Ansprüche,	Nr.:							
		Zeichnungen,	Blatt:							
5.		Dieser Bericht ist oh angegebenen Gründ eingereichten Fassu (Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	den nach A Ing hinausg	uffassu jehen (	ing der Behör Regel 70.2(c)	de über den ).	Offenbarun	gsgehalt in	der ursprüngli	ch
6.	5. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:									
V.		gründete Feststellun verblichen Anwendb								nd de
1.	Fes	tstellung								
	Neu	uheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-6				
	Erfii	nderische Tätigkeit (E	ET)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-6		·		
	Gev	verbliche Anwendbarl	keit (GA)	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-6				
2.	Unt	erlagen und Erklärung	gen							

# VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

siehe Beiblatt

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt



# Zu Punkt I

# Grundlage des Berichts

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

In der Fassung für die Vertragsstaaten: AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IT IE LI LU MC NL PT SE

Beschreibung, Seiten:

1-14

ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-6

ursprüngliche Fassung

Zeichnungen, Blätter:

1/1

ursprüngliche Fassung

# Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Es wird auf das folgenden Dokument verwiesen:

D1 = WO98/15010.

Der Gegenstand der Ansprüche erscheint neu und erfinderisch im Hinblick auf den erhältlichen Stand der Technik. Zwar offenbart D1 einen Thyristor mit einer durch Bestrahlung verringerten Transistorverstärkung, jedoch legt das Dokument nicht nahe,

- die Transistorverstärkung der Treiberstufe größer zu halten als diejenige,



welche unterhalb der Thyristorkathode durch Kathodenemitter, Kathodenbasis und Anodenbasis definiert wird, bzw.

- die Transistorverstärkung der Treiberstufe größer zu halten als diejenige, welche unterhalb der Thyristorkathode durch Kathodenbasis, Anodenbasis und Anodenemitter definiert wird, bzw.
- Anodenkurzschlüsse mit verringerter Leitfähigkeit unterhalb der Thyristorkathode vorzusehen.

# Zu Punkt VII

# Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

- 1. Der Anmelder hat keine Gründe dafür genannt, warum der Anspruch 1 nicht die zweiteilige Form haben sollte. Ferner hat er in der Beschreibung nicht klar angegeben, welche Merkmale des Gegenstands des Anspruchs 1 bereits aus dem Dokument D1 bekannt sind; siehe die PCT Richtlinien, III-2.3a.
- 2. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.



Cardiovascular Pharmacology 24(Suppl. 2):S39-S49) (1994)).

Initially, the higher circulating levels of insulin compensate for the reduced sensitivity to the hormone. As the pancreas decompensates and becomes unable to keep up 5 with the demand, a fragile metabolic state of impaired glucose tolerance results. In this state, the organism is unable to handle a high influx of glucose into the bloodstream, for example after a meal or to a glucose challenge. This typically demonstrated by the slow rate in 10 normalizing plasma glucose after a meal compared to normal individuals. It is at this point that non-insulin-dependent diabetes is usually diagnosed.

The period of some 5-10 years proceeding the development of impaired glucose tolerance is thus associated 15 with a number of hormonal imbalances, e.g., increased basal insulin and glucagon production, elevated adrenal corticoid secretion (Bjornstop, P., In: Current Topics in Diabetes Research, eds. Belfore, F., Bergman, RN, and Molinath, GM, Front Diabetes, Basel, Karger, 12:182-192 (1993)), giving 20 rise to the characteristic enlargement of visceral fat mass, hypertension, insulin resistance, and hyperlipidemia.

The cluster of these metabolic abnormalities has been referred to as "Syndrome X", "Metabolic Syndrome", "insulin resistant syndrome", or "Plurimetabolic Syndrome"

25 (Reaven, G.M., Diabetes 37:1595-1607 (1988); Branchi, R., et al., Diab. Nutr. Metab. 7:43-51 (1994)). The condition was also shown to be associated with an increased risk for atherosclerosis, and coronary heart disease (reviewed in

WO 98/51332 PCT/EP98/03000

SOMATOSTATIN AND SOMATOSTATIN AGONISTS FOR TREATING INSULIN INSENSITIVITY AND SYNDROME  $\boldsymbol{\mathsf{X}}$ 

This invention relates to a method and compositions for the treatment of insulin insensitivity and Syndrome X.

# BACKGROUND OF THE INVENTION

Non-insulin-dependent diabetes mellitus (NIDDM) is highly prevalent in the U.S. population, reaching 10-20% in people 50 years and older. This incidence is higher among 10 certain ethnic groups (Harris, M.I., Diabetes Care 16:642-652 (1993)). The condition is associated in the early phase with obesity, especially visceral and middle obesity. progression from obesity to non-insulin dependent diabetes is characterized by the gradual development of insulin 15 resistance occurring at least 4-7 years before clinical diagnosis of NIDDM (Harris, M.I., Diabetes Care 16:642-652 (1993); Harris, M.I., et al., Diabetes Care 15:815-819 (1992)). Insulin resistance is defined as the decrease in the biological action of insulin on the classical insulin 20 sensitive tissues, namely muscle and liver leading to a reduced uptake and utilization of glucose from the bloodstream. In response to the reduced actions of insulin, the mounting plasma glucose induces the pancreas to put out more insulin leading to a higher basal circulating levels of 25 the hormone in the interprandial state. Thus, insulin resistance often presents as hyperinsulinemia (Bonner, G., J

# FOR THE PURPOSES OF INFORMATION ONLY

Codes used to identify States party to the PCT on the front pages of pamphlets publishing international applications under the PCT.

AL	Albania	ES	Spain	LS	Lesotho	SI	Slovenia
AM	Armenia	FI	Finland	LT	Lithuania	SK	Slovakia
AT	Austria	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Senegal
ΑU	Australia	GA	Gabon	LV	Latvia	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaijan	GB	United Kingdom	MC	Monaco	TD	Chad
BA	Bosnia and Herzegovina	GE	Georgia	MD	Republic of Moldova	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagascar	ТJ	Tajikistan
BE	Belgium	GN	Guinea	MK	The former Yugoslav	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Greece		Republic of Macedonia	TR	Turkey
BG	Bulgaria	HU	Hungary	ML	Mali	TT	Trinidad and Tobago
ВJ	Benin	IE	Ireland	MN	Mongolia	UA	Ukraine
BR	Brazil	IL	Israel	MR	Mauritania	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	[celand	MW	Malawi	US	United States of America
CA	Canada	ĬТ	Italy	MX	Mexico	UZ	Uzbekistan
CF	Central African Republic	JР	Japan	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Netherlands	YU	Yugoslavia
CH	Switzerland	KG	Kyrgyzstan	NO	Norway	zw	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Democratic People's	NZ	New Zealand		
CM	Cameroon		Republic of Korea	PL	Poland		
CN	China	KR	Republic of Korea	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Romania		
CZ	Czech Republic	LC	Saint Lucia	RU	Russian Federation		
DE	Germany	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Denmark	LK	Sri Lanka	SE	Sweden		
EE	Estonia	LR	Liberia	SG	Singapore		

# **PCT**





(51) International Patent Classification <sup>6</sup> :		JNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)					
(51) International Patent Classification •:  A61K 38/31	A1	(11) International Publication Number: WO 98/51332					
A01K 38/31	Ai	(43) International Publication Date: 19 November 1998 (19.11.98)					
(21) International Application Number: PCT/EP (22) International Filing Date: 13 May 1998 ( (30) Priority Data:	(81) Designated States: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, GM, GW, HU, ID, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO						
08/854,943  13 May 1997 (13.05.97)  US  patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, Upatent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, IE, IT, LU, MC, IE, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). OAPI patent (AT, BE, CH, CY,							
(72) Inventors; and (75) Inventors/Applicants (for US only): CAWTHORNE, Anthony [GB/GB]; University of Buckingham. Cleratory, Hunter Street, Buckingham, Bucks MK18 1 LIU. Yong-Ling [GB/GB]; Clore House, Hunter Buckingham, Bucks MK18 1EG (GB). SENNITT, V. [GB/GB]; Clore House, Hunter Street, Bucks MK18 1EG (GB).	claims and to be republished in the event of the receipt of amendments. et, N,						
(74) Agent: LUNT, Mark, George, Francis; Dibb Lupto Fountain Precinct, Balm Green, Sheffield S1 1RZ		p,					
(54) Title: SOMATOSTATIN AND SOMATOSTATIN AGONISTS FOR TREATING INSULIN INSENSITIVITY AND SYNDROME							
(57) Abstract							
The present invention relates to a method of treating insulin resistance or Syndrome X. The method includes the step of administering a therapeutically effective amount of a somatostatin or a somatostatin agonist to said patient. The invention also includes pharmaceutical compositions comprising a somatostatin or somatostatin agonist and the use of such products in the preparation of such compositions.							

# (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 5. April 2001 (05.04.2001)

**PCT** 

# (10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/24274 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

\_\_\_\_

- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/03351
- (22) Internationales Anmeldedatum:
  26. September 2000 (26.09.2000)
- (25) Einreichungssprache:

Deutsch

H01L 29/74

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (30) Angaben zur Priorität: 199 47 028.6 30. September 1999 (30.09.1999) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

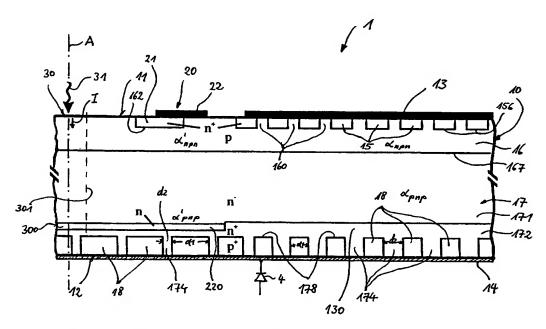
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): NIEDERNOS-THEIDE, Franz, Josef [DE/DE]; Isegrimstrasse 8, D-81739 München (DE). SCHULZE, Hans-Joachim [DE/DE]; Ottostrasse 60F, D-85521 Ottobrunn (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

### Veröffentlicht:

Mit internationalem Recherchenbericht.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

- (54) Title: THYRISTOR WITH RECOVERY TIME VOLTAGE SURGE RESISTANCE
- (54) Bezeichnung: THYRISTOR MIT SPANNUNGSSTOSSBELASTBARKEIT IN DER FREIWERDEZEIT



(57) Abstract: A preferably asymmetric thyristor (1) with at least one driver stage (20) for amplification of the gate current (1) inputted on the cathode-side base (16) of the thyristor, where the driver stage amplification factors  $\alpha_{npn}$  and  $\alpha_{pnp}$  are each bigger than in the preferred thyristor and anode short circuits in the thyristor (174) have a lower electrical conductivity in the driver stage than in the thyristor.

VO 01/24274 A1



Vor Ablauf der f\(\text{u}\)r \(\text{Anderungen der Anspr\(\text{u}\)che geltenden Frist: \(\text{Ver\(\text{o}\)ffentlichung wird wiederholt, falls \(\text{Anderungen}\) eintreffen. Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

1

#### Beschreibung

Thyristor mit Spannungsstoßbelastbarkeit in der Freiwerdezeit

Die Erfindung betrifft einen Thyristor mit dem folgenden Aufbau:

In einem Körper aus unterschiedlich dotiertem Halbleitermaterial, der eine als Kathode dienende Elektrode und eine als Anode dienende Elektrode aufweist, sind

- ein kathodenseitiger Emitter eines ersten Leitungstyps
- eine kathodenseitige Basis eines zweiten Leitungstyps,
- eine anodenseitige Basis des ersten Leitungstyps,
- ein anodenseitiger Emitter des zweiten Leitungstyps und
- wenigstens eine Treiberstufe zum Verstärken eines in die kathodenseitige Basis eingespeisten Steuerstromes ausgebildet, und
- die Treiberstufe weist einen in der kathodenseitigen Basis ausgebildeten und vom kathodenseitigen Emitter getrennten weiteren Emitter des ersten Leitungstyps sowie eine sowohl die kathodenseitige Basis als auch den weiteren Emitter kontaktierende Metallisierung auf.

Ein Thyristor der genannten Art ist aus H. Mitlehner, J. Sack, H.-J- Schulze: "High Voltage Thyristor for HVDC Transmission and Static VAR Compensators", Proceedings of PESC, Kyoto, 1988, S. 934 oder aus WO 98/34282 (97P1089) bekannt. Bei diesem bekannten Thyristor ist der kathodenseitige Emitter des ersten Leitungstyps durch einen an eine Hauptfläche des scheibenförmigen, aus Halbleitermaterial in Form von Silizium bestehenden Körpers grenzenden n<sup>+</sup>-dotierten Bereich dieses Körpers definiert.

Die kathodenseitige Basis des zweiten Leitungstyps ist durch einen an den n<sup>+</sup>-dotierten Bereich grenzenden und zusammen mit diesem Bereich einen np-Übergang bildenden p-dotierten Bereich des Körpers definiert.

2

Die anodenseitige Basis des ersten Leitungstyps ist durch einen n-dotierten Bereich und einen n+dotierten Bereich des Körpers definiert, die aneinandergrenzen und von denen der n-dotierten Bereich an den p-dotierten Bereich der kathodenseitigen Basis grenzt und zusammen mit diesem Bereich einen pn-Übergang bildet.

Der anodenseitige Emitter des zweiten Leitungstyps ist durch einen p<sup>+</sup>-dotierten Bereich des Körpers definiert, der einerseits an den n<sup>+</sup>-dotierten Bereich der anodenseitigen Basis grenzt und zusammen mit diesem Bereich einen np-Übergang bildet und andererseits an die von der einen Hauptfläche abgekehrte Hauptfläche des Körpers grenzt.

Im kathodenseitigen Emitter des Thyristors sind Kathodenkurzschlüsse ausgebildet, welche die kathodenseitige Basis und die Kathode miteinander verbinden und die gewährleisten, daß der Thyristor auch bei einer großen dU/dt-Belastung von einigen 1000 Volt/ $\mu$ s nicht bereits vor dem Erreichen der statischen Kippspannung unkontrolliert zündet.

Um den Einfluß eines Leckstromes auf einen unterhalb der Kathode des Thyristors durch die kathodenseitige Basis, die anodenseitigen Basis und den anodenseitigen Emitter definierten Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha_{\rm pnp}$  des Thyristors bei geringer Leckstromdichte zu unterdrücken, sind im anodenseitigen Emitter mehrere Anodenkurzschlüsse ausgebildet, welche die anodenseitige Basis und die Anode miteinander verbinden.

Der weitere Emitter der einzigen Treiberstufe ("Amplifying-Gate") ist durch einen an die eine Hauptfläche des Körpers grenzenden, aber vom n<sup>+</sup>-dotierten Bereich des kathodenseitigen Emitters räumlich getrennten n<sup>+</sup>-dotierten Bereich definiert, der im p-dotierten Bereich der kathodenseitigen Basis ausgebildet ist und zusammen mit diesem Bereich einen np-Übergang bildet.

3

Der p-dotierte Bereich der kathodenseitigen Basis grenzt seitlich neben dem  $n^+$ -dotierten Bereich des weiteren Emitters ebenfalls an die eine Hauptfläche des Körpers. Die Metallisierung ist auf dieser einen Hauptfläche aufgebracht und kontaktiert sowohl den p-dotierten Bereich der kathodenseitigen Basis als auch den  $n^+$ -dotierten Bereich des weiteren Emitters.

Anstelle nur einer solchen Treiberstufe können deren zwei oder mehrere vorhanden sein (siehe beispielsweise Figur 5 des oben zuerst genannten Dokuments).

Der in den p-dotierten Bereich der kathodenseitigen Basis eingespeiste Steuerstrom wird an einer Stelle neben dem  $n^+$ -dotierten weiteren Emitter der Treiberstufe erzeugt, bei welcher der p-dotierte Bereich der kathodenseitigen Basis frei von der Metallisierung der Treiberstufe an die eine Hauptfläche des Körpers grenzt.

Der Steuerstrom kann mit Hilfe eines Zündkontaktes und/oder einer lichtempfindlichen Struktur erzeugt werden, der bzw. die an dieser Stelle an der einen Hauptfläche des Körpers ausgebildet sind/ist.

Insbesondere ist der Thyristor bezüglich einer auf den beiden Hauptflächen des Körpers senkrecht stehenden Achse rotationssymmetrisch ausgebildet. Die Stelle zum Einspeisen des Steuerstroms liegt in einem die Achse umgebenden zentralen Teilbereich der einen Hauptfläche des scheibenförmigen Körpers.

Die Treiberstufe ist radial zur Achse zwischen dem zentralen Teilbereich und der Kathode des Thyristors angeordnet.

Der bekannte Thyrsistor ist überdies ein asymmetrischer Thyristor, der eine Stoppzone des ersten Leitungstyps aufweist, die durch den  $n^+$ -dotierten Bereich der anodenseitigen Basis gebildet ist. Diese Stoppzone bewirkt, daß die Überkopfzün-

4

dung des Thyristors nicht durch einen Lawinendurchbruch (Avalanche-Effekt), sondern durch den sogenannten "Punchthrough"-Effekt, d.h. durch die Ausdehnung der Raumladungszone des in Sperrrichtung gepolten pn-Übergangs zwischen der kathodenseitigen Basis und der anodenseitigen Basis bis hin zu dem in Durchlaßrichtung gepolten np-Übergang zwischen der anodenseitigen Basis und dem anodenseitigen Emitter im Körper aus Halbleitermaterial erzwungen wird.

Der aus dem oben zuerst genannten Dokument bekannte asymmetrische Thyristor weist die Besonderheit auf, daß er mit einer Diode in Reihe geschaltet ist und zusammen mit dieser Diode einen Tandemthyristor bildet, der eine Alternative zu einem aus zwei in Reihe geschalteten symmetrischen Thyristoren bestehenden Tandemthyristor ist.

Der aus WO 98/34282 bekannte Thyristor weist die Besonderheit auf, daß die n<sup>+</sup>-dotierte Stoppzone in einem unterhalb des zentralen Teilbereichs liegenden Bereich schwächer dotiert ist als im lateral angrenzenden Bereich. Diese Besonderheit hat den Vorteil, daß die Kippspannung des Thyristors nicht oder nur unwesentlich von der Temperatur abhängt. Dabei besteht überdies der Vorteil, daß sich eine Stoppzone, die neben einem höher dotierten Bereich einen vergleichsweise schwächer dotierten Bereich aufweist, einfach und kostengünstig, beispielsweise mittels "maskierter" Implantation, herstellen läßt.

Aus H.-J. Schulze, M. Ruff, B. Baur, F. Pfirsch, H. Kabza, U. Kellner, P. Voss: "Light Triggered 8 kV Thyristor with a New Type of Integrated Breakover Diode", Proceedings of PCIM, Maui, 1996, S. 465 - 472 ist es bekannt, bei symmetrisch sperrenden Thyristoren in einer im Zentralbereich des Thyristors befindlichen Amplifying-Gate-Struktur eine höhere Trägerlebensdauer als im Bereich unter der Kathode der einen Hauptfläche des Körpers aus Halbleitermaterial zu realisieren.

5

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen Thyristor bereitzustellen, der innerhalb der Freiwerdezeit mit einem Spannungsstoß belastet werden kann, ohne daß dabei der Thyristor durch eine in dem unterhalb der Kathode des Thyristors liegenden Bereich des Körpers aus Halbleitermaterial üblicherweise auftretende Stromfilamentierung zerstört wird.

Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Gemäß dieser Lösung ist ein Thyristor mit dem folgenden Aufbau bereitgestellt:

In einem Körper aus unterschiedlich dotiertem Halbleitermaterial, der eine als Kathode dienende Elektrode sowie eine als Anode dienende Elektrode aufweist, sind

- ein kathodenseitiger Emitter eines ersten Leitungstyps
- eine kathodenseitige Basis eines zweiten Leitungstyps,
- eine anodenseitige Basis des ersten Leitungstyps,
- ein anodenseitiger Emitter des zweiten Leitungstyps und
- wenigstens eine Treiberstufe zum Verstärken eines in die kathodenseitige Basis eingespeisten Steuerstromes ausgebildet.
- die Treiberstufe weist einen in der kathodenseitigen Basis ausgebildeten und vom kathodenseitigen Emitter getrennten weiteren Emitter des ersten Leitungstyps sowie eine sowohl die kathodenseitige Basis als auch den weiteren Emitter kontaktierende Metallisierung auf,
- ein unterhalb der Metallisierung der wenigstens einen Treiberstufe durch den weiteren Emitter, die kathodenseitige Basis und die anodenseitige Basis definierter Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha\,{}^{}_{npn}$  dieser Treiberstufe ist größer als ein unterhalb der Kathode des Thyristors durch den kathodenseitigen Emitter, die kathodenseitige Basis und die anodenseitige Basis definierter Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha_{npn}$  des Thyristors,

und/oder

6

- ein unterhalb der Metallisierung der wenigstens einen Treiberstufe durch die kathodenseitige Basis, die anodenseitige Basis und den anodenseitigen Emitter definierter Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha\,\dot{}_{pnp}$  dieser Treiberstufe ist größer als ein unterhalb der Kathode des Thyristors durch die kathodenseitige Basis, die anodenseitige Basis und den anodenseitigen Emitter definierter Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha_{pnp}$  des Thyristors,

#### und/oder

- Anodenkurzschlüsse verbinden die anodenseitige Basis und die Anode miteinander und weisen unterhalb der Metallisierung der wenigstens einen Treiberstufe eine kleinere elektrische Leitfähigkeit als unterhalb der Kathode des Thyristors auf.

Danach unterscheidet sich der erfindungsgemäße Thyristor von dem Thyristor der eingangs genannten Art dadurch, daß der Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha$ 'npn der wenigstens einen Treiberstufe größer ist als der Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha$ npn des Thyristors und/oder daß der Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha$ 'pnp dieser Treiberstufe größer ist als der Transistorverstärkungsfaktor stärkungsfaktor  $\alpha$ pnp des Thyristors.

Durch diese Lösung wird vorteilhafterweise erreicht, daß eine durch einen Spannungsstoß innerhalb der Freiwerdezeit ausgelöste Zündung des Thyristors zuerst außerhalb des unterhalb der Kathode des Thyristors liegenden Bereichs des Körpers aus Halbleitermaterial und möglichst innerhalb einer Treiberstufe stattfindet. Die gezielte Verlagerung der Zündung von dem unterhalb der Kathode liegenden Bereich in die Treiberstufe hat zur Folge, daß sich die dem Spannungsstoß folgende Zündfront sehr schnell ausbreiten kann und somit eine Stromfilamentierung vermieden wird.

Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, daß durch Dimensionierung des Thyristors so, daß der Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha$ 'npn und/oder  $\alpha$ 'pnp der zumindest einen Treiberstufe größer, vorzugsweise deutlich höher ist als der Transistor-

7

verstärkungsfaktor  $\alpha_{npn}$  und/oder  $\alpha_{pnp}$  des Thyristors, eine stärkere Überschwemmung mit freien Ladungsträgern und ein Erlöschen des Stromflusses in dieser Treiberstufe bewirkt wird. Vorzugsweise ist sowohl  $\alpha'_{npn}$  größer als  $\alpha_{npn}$  als auch  $\alpha'_{pnp}$  größer als  $\alpha_{pnp}$  eingestellt.

Im Regelfall, d.h. ohne eine solche Dimensionierung der Transistorverstärkungsfaktoren  $\alpha\,{}^{}_{npn},\,\alpha\,{}^{}_{pnp},\,\alpha_{npn}$  und  $\alpha_{pnp}$  tritt die Zündung bei Spannungsstoß innerhalb der Freiwerdezeit nicht in der Treiberstufe, insbesondere in dem unterhalb der Metallisierung dieser Stufe liegenden Bereich auf, weil zu diesem Zeitpunkt in der Treiberstufe – im Gegensatz zu dem unterhalb der Kathode liegenden Bereich des Thyristors – keine oder wenige freie Ladungsträger, die bekanntermaßen den Zündvorgang begünstigen, vorhanden sind. Der Grund hierfür ist, daß die Treiberstufe wesentlich früher als der Thyristors unter der Kathode wieder abschaltet.

Bevorzugter- und vorteilhafterweise weist bei dem erfindungsgemäßen Thyristor die anodenseitige Basis eine Stoppzone des ersten Leitungstyps auf, was bedeutet, daß der Thyristor ein asymmetrischer Thyristor ist.

Bei einem solchen asymmetrischen Thyristor kann vorteilhafterweise eine Erhöhung der Transistorverstärkungsfaktoren  $\alpha$ 'npn,  $\alpha$ 'pnp der wenigstens einen Treiberstufe gegenüber den Transistorverstärkungsfaktoren  $\alpha_{npn}$ ,  $\alpha_{pnp}$  des Thyristors in dem unterhalb dessen Kathode liegenden Bereich auf einfache Weise dadurch realisiert werden, daß die Stoppzone in dem unterhalb der Metallisierung dieser Treiberstufe liegenden Bereich schwächer dotiert ist als in einem unterhalb der Kathode des Thyristors liegenden Bereich.

Bei einer bevorzugten und vorteilhaften Ausgestaltung dieses asymmetrischen Thyristors ist die Stoppzone in dem unterhalb der Metallisierung der wenigstens einen Treiberstufe liegenden Bereich höher dotiert ist als unterhalb einer Stelle zum

8

Einspeisen eines Steuerstroms in die kathodenseitige Basis. Ein Vorteil dieser Ausgestaltung ist darin zu sehen, daß neben der Spannungsstoßbelastbarkeit in der Freiwerdezeit auch ein Licht- und/oder Überkopfzündschutz des Thyristors gegeben ist.

Die Erfindung beruht auch auf der Erkenntnis, daß alternativ oder zusätzlich zur vorstehenden Dimensionierungsvorschrift das Erlöschen des Stroms in einer Treiberstufe dadurch behindert werden kann, daß Anodenkurzschlüsse die anodenseitige Basis und die Anode miteinander verbinden und unterhalb der Metallisierung der wenigstens einen Treiberstufe eine kleinere elektrische Leitfähigkeit als unterhalb der Kathode des Thyristors aufweisen.

Die Anwendung von Anodenkurzschlüssen ist allgemein vorteilhaft.

Eine kleinere elektrische Leitfähigkeit von Anodenkurzschlüssen kann beispielsweise durch einen größeren Abstand der Anodenkurzschlüsse voneinander und/oder einen geringeren Durchmesser dieser Kurzschlüsse erreicht werden.

Demgemäß weisen bei einer vorteilhaften und bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Thyristors Anodenkurzschlüsse unterhalb der Metallisierung der wenigstens einen Treiberstufe einen größeren Abstand voneinander und/oder einen geringeren Durchmesser als unterhalb der Kathode des Thyristors auf.

Zusätzlich ist es vorteilhaft, die Ladungsträger-Lebensdauer in einem außerhalb der Kathode des Thyristors liegenden Bereich des Körpers aus Halbleitermaterial größer, vorzugsweise deutlich höher als in dem unterhalb der Kathode liegenden Bereich einzustellen. Dies läßt sich zum Beispiel durch eine maskierte Bestrahlung des Körpers mit Elektronen oder Protonen realisieren, wobei der außerhalb der Kathode liegende Be-

9

reich während der Bestrahlung mit einer Metallmaske abgedeckt wird und der unterhalb der Kathode liegende Bereich offen ist. Um eine sinnvolle Abstufung der Trägerlebensdauer im außerhalb der Kathode liegenden Bereich und der Trägerlebensdauer im unterhalb der Kathode liegenden Bereich mit dem Ziel zufriedenstellender Kippspannungen und Freiwerdezeiten zu erreichen, sollte im Allgemeinen eine zweite ganzflächige Bestrahlung des Körpers zeitlich vor- und/oder nachgeschaltet sein.

Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung ist eine Anordnung aus einem erfindungsgemäßen asymmetrischen Thyristor und einer Diode, wobei der Thyristor und die Diode elektrisch miteinander verbunden sind. Durch diese Anordnung ist ein neuartiger Tandemthyristor geschaffen, der den Vorteil aufweist, daß der asymmetrische Thyristor bei Sperrbelastung in Rückwärtsrichtung keine Raumladungszone aufweist, so daß in diesem Fall ein raumladungsbedingtes Ausräumen freier Ladungsträger, insbesondere der freien Ladungsträger, mit denen die Treiberstufe überschwemmt ist, entfällt, und somit diese freien Ladungsträger länger erhalten bleiben.

Durch die Erfindung ist vorteilhafterweise ein integrierter Freiwerdeschutz realisierbar, der unter allen Betriebsbedingungen wirksam ist.

Die Erfindung wird in der nachfolgenden Beschreibung anhand der Zeichnung beispielhaft näher erläutert.

Die Figur zeigt ein Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Thyristors im Querschnitt.

Der in der Figur im Querschnitt dargestellte und generell mit 1 bezeichnete Thyristor weist einen Körper 10 aus unterschiedlich dotiertem Halbleitermaterial, beispielsweise Silizium, auf. Der Körper 10 hat beispielsweise die Form einer

10

Scheibe, die zwei voneinander abgekehrte Hauptflächen 11 und 12 aufweist.

Auf der Hauptfläche 11 ist eine als Kathode des Thyristors 1 dienende Elektrode 13 und auf der Hauptfläche 12 eine als Anode des Thyristors 1 dienende Elektrode 14 ausgebildet.

Der Thyristor 1 ist beispielsweise rotationssymmetrisch bezüglich einer auf den beiden Hauptflächen 11 und 12 des Körpers 10 senkrecht stehenden Achse A.

Der kathodenseitige Emitter des ersten Leitungstyps ist durch einen an die Hauptfläche 11 des Körpers 10 grenzenden n<sup>+</sup>- dotierten Bereich 15 dieses Körpers 10 definiert.

Die kathodenseitige Basis des zweiten Leitungstyps ist durch einen an den  $n^+$ -dotierten Bereich 15 grenzenden und zusammen mit diesem Bereich 15 einen np-Übergang 156 bildenden p-dotierten Bereich 16 des Körpers 10 definiert.

Die anodenseitige Basis 17 des ersten Leitungstyps ist durch einen  $n^-$ -dotierten Bereich 171 und einen  $n^+$ -dotierten Bereich 172 des Körpers 10 definiert, die aneinandergrenzen und von denen der  $n^-$ -dotierten Bereich 171 an den p-dotierten Bereich 16 der kathodenseitigen Basis grenzt und zusammen mit diesem Bereich 16 einen pn-Übergang 167 bildet.

Der anodenseitige Emitter des zweiten Leitungstyps ist durch einen p<sup>+</sup>-dotierten Bereich 18 des Körpers 10 definiert, der einerseits an den n<sup>+</sup>-dotierten Bereich 172 der anodenseitigen Basis 17 grenzt und zusammen mit diesem Bereich 172 einen np-Übergang 178 bildet und andererseits an die Hauptfläche 12 des Körpers 10 grenzt.

Im kathodenseitigen Emitter 15 sind ein oder mehrere Kathodenkurzschlüsse 160 ausgebildet, deren jeder die kathodenseitigen Basis 16 und die Kathode 13 miteinander verbindet. Die-

11

se Kathodenkurzschlüsse 160 gewährleisten, daß der Thyristor 1 auch bei einer großen dU/dt-Belastung von einigen 1000 Volt/ $\mu$ s nicht bereits vor dem Erreichen der statischen Kippspannung unkontrolliert zündet.

Um den Einfluß eines Leckstromes auf den durch die kathodenseitige Basis 16, die anodenseitigen Basis 17 und den anodenseitigen Emitter 18 definierten Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha_{\rm pnp}$  des Thyristors 1 bei geringen Leckstromdichten zu unterdrücken, sind im anodenseitigen Emitter 18 ein oder mehrere Anodenkurzschlüsse 174 ausgebildet, deren jeder die anodenseitige Basis 17 und die Anode 14 miteinander verbindet.

Der Körper 10 weist wenigstens eine Treiberstufe 20 zum Verstärken eines in die kathodenseitige Basis 16 durch die Hauptfläche 11 eingespeisten Steuerstromes I auf.

Die Treiberstufe 20 weist einen im p-dotierten Bereich 16 der kathodenseitigen Basis ausgebildeten und vom kathodenseitigen Emitter 15 und der Kathode 13 Basis des Thyristors 1 räumlich getrennten weiteren Emitter 21 in Form eines an die Hauptfläche 11 des Körpers 10 grenzenden und beispielsweise n<sup>+</sup>- dotierten Bereichs sowie eine auf dieser Hauptfläche 11 des Körpers 10 ausgebildete und vom kathodenseitigen Emitter 15 und der Kathode 13 Basis des Thyristors 1 räumlich getrennte Metallisierung 22 auf, die sowohl den n<sup>+</sup>-dotierten weiteren Emitter 21 als auch die seitlich neben dem weiteren Emitter 21 ebenfalls an die Hauptfläche 11 des Körpers 10 grenzende p-dotierte kathodenseitige Basis 16 kontaktiert.

Der  $n^+$ -dotierte weitere Emitter 21 der Treiberstufe bildet zusammen mit der p-dotierten kathodenseitigen Basis 16 des Thyristors einen np-Übergang 162.

Anstelle nur einer Treiberstufe 21 können eine oder mehrere nicht dargestellte zusätzliche Treiberstufen vorhanden sein, deren jede je einen an die Hauptfläche 11 des Körpers 10

12

grenzenden weiteren Emitter und je eine auf dieser Hauptfläche 11 ausgebildete Metallisierung aufweist, die sowohl diesen weiteren Emitter als auch die kathodenseitige Basis 16 kontaktiert. Der weitere Emitter und die Metallisierung jeder zusätzlichen Treiberstufe sind räumlich vom Emitter und der Metallisierung der Treiberstufe 20 und jeder anderen zusätzlichen Treiberstufe sowie vom kathodenseitigen Emitter 15 und der Kathode 13 des Thyristors 1 getrennt angeordnet.

Der in die kathodenseitigen Basis 16 eingespeiste Steuerstrom I wird an einer Stelle 30 der Hauptfläche 11 des Körpers 10 erzeugt, die sich neben dem n<sup>+</sup>-dotierten weiteren Emitter 21 der Treiberstufe 20 befindet und an der die kathodenseitige Basis 16 frei von der Metallisierung 22 der Treiberstufe 20 und der Kathode 13 des Thyristors 1 an die Hauptfläche 11 des Körpers 10 grenzt.

Die Stelle 30 zum Einspeisen des Steuerstroms I ist beispielsweise ein die Achse A umgebender zentraler Teilbereich der Hauptfläche 11 des Körpers 10.

Der Steuerstrom I kann mit Hilfe einer auf oder unter der Stelle 30 ausgebildeten nicht dargestellten lichtempfindlichen Struktur durch Einstrahlen optischer Strahlung 31 in die Struktur und/oder eines auf dieser Stelle 30 ausgebildeten und ebenfalls nicht dargestellten Zündkontaktes (siehe dazu beispielsweise WO 98/34282) erzeugt werden.

Die Treiberstufe 20 ist radial zur Achse A zwischen der Stelle 30 und dem kathodenseitigen Emitter 15 und der Kathode 13 des Thyristors 1 angeordnet.

Der Thyristor 1 und die Treiberstufe 20 sind erfindungsgemäß so ausgebildet und bemessen, daß

- der unterhalb der Metallisierung 22 der Treiberstufe 20 durch den weiteren Emitter 21, die kathodenseitige Basis 16 und die anodenseitige Basis 17 definierte Transistorverstär-

13

kungsfaktor  $\alpha$ 'npn dieser Treiberstufe 20 größer ist als der unterhalb der Kathode 13 des Thyristors 1 durch den kathodenseitigen Emitter 15, die kathodenseitige Basis 16 und die anodenseitige Basis 17 definierte Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha_{npn}$  des Thyristors 1, und/oder daß

- der unterhalb der Metallisierung 22 der wenigstens einen Treiberstufe 20 durch die kathodenseitige Basis 16, die anodenseitige Basis 17 und den anodenseitigen Emitter 18 definierte Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha\,{}^{}_{pnp}$  dieser Treiberstufe 20 größer ist als der unterhalb der Kathode 13 des Thyristors 1 durch die kathodenseitige Basis 16, die anodenseitige Basis 17 und den anodenseitigen Emitter 18 definierte Transistorverstärkungsfaktor  $\alpha_{pnp}$  des Thyristors 1.

Vorzugsweise ist  $\alpha$ 'npn >  $\alpha_{npn}$  und zugleich  $\alpha$ 'pnp >  $\alpha_{pnp}$  gewählt.

Sind neben der Treiberstufe 20 eine oder mehrere zusätzliche Treiberstufen vorhanden, so kann die vorstehende Vorschrift auch für eine oder mehrere oder sogar jede zusätzliche Treiberstufe realisiert sein, obgleich es genügt, wenn diese Vorschrift nur für eine einzige der mehreren Treiberstufen, im vorliegenden Fall für die Treiberstufe 20 realisiert ist.

Der beispielhafte Thyristor 1 ist ein asymmetrischer Thyristor, bei dem die anodenseitige Basis 17 eine Stoppzone des ersten Leitungstyps n aufweist, die durch den  $n^+$ -dotierten Bereich 172 dieser Basis 17 gebildet ist.

Bei einem solchen asymmetrischen Thyristor 1 kann die vorstehende Dimensionsvorschrift bezüglich der Transistorverstärkungsfaktoren auf einfache Weise dadurch realisiert werden, daß die Stoppzone 172 in einem unterhalb der Metallisierung 22 der wenigstens einen Treiberstufe 20 liegenden Bereich 220 schwächer dotiert ist als in einem unterhalb der Kathode 13 des Thyristors 1 liegenden Bereich 130.

14

Der schwächer dotierte Bereich 220 der Stoppzone 172 erstreckt sich vorzugsweise bis unter die Stelle 30 zum Einspeisen eines Steuerstromes I in die kathodenseitige Basis 16.

Der sich auch unter der Stelle 30 erstreckende schwächer dotierte Bereich 220 der Stoppzone 172 kann unter dieser Stelle 30 gleich schwach dotiert sein wie außerhalb dieser Stelle 30.

Die Stoppzone 172 kann in dem unterhalb der Metallisierung 22 der wenigstens einen Treiberstufe 20 liegenden Bereich 220 auch höher dotiert sein als in dem unterhalb der Stelle 30 liegenden Bereich 300, der durch die zur Achse A parallele gestrichelte Linie 301 vom übrigen schwächer dotierten Bereich 220 der Stoppzone 172 abgegrenzt ist.

Die Anodenkurzschlüsse 174 weisen unterhalb der Metallisierung 22 der Treiberstufe 20 eine kleinere elektrische Leitfähigkeit als unterhalb der Kathode 13 des Thyristors 1 auf. Dies ist auf einfache Weise dadurch realisiert, daß ein Abstand d1 der Anodenkurzschlüsse 174 voneinander unterhalb der Metallisierung 22 der Treiberstufe 20 größer als unterhalb der Kathode 13 des Thyristors 1 ist und/oder ein Durchmesser d2 der Anodenkurzschlüsse 174 unterhalb der Metallisierung 22 der Treiberstufe 20 kleiner als unterhalb der Kathode 13 des Thyristors 1 ist.

Bei Vorhandensein eines oder mehrerer zusätzlicher Treiberstufen kann diese Maßnahme alternativ zur Treiberstufe 20 oder zusätzlich zu dieser bei einer, mehreren oder allen zusätzlichen Treiberstufen realisiert sein.

Wird an die Anode 14 des Thyristors 1 wie in der Figur dargestellt eine Diode 4 angeschlossen, so ist ein asymmetrischer Tandemthyristor realisiert.

15

### Patentansprüche

- 1. Thyristor (1) mit dem folgenden Aufbau:
- In einem Körper (10) aus unterschiedlich dotiertem Halbleitermaterial, der eine als Kathode dienende Elektrode (13) sowie eine als Anode dienende Elektrode (14) aufweist, sind
- ein kathodenseitiger Emitter (15) eines ersten Leitungstyps (n)
- eine kathodenseitige Basis (16) eines zweiten Leitungstyps (p),
- eine anodenseitige Basis (17) des ersten Leitungstyps (n),
- ein anodenseitiger Emitter (18) des zweiten Leitungstyps (p) und
- wenigstens eine Treiberstufe (20) zum Verstärken eines in die kathodenseitige Basis (16) eingespeisten Steuerstromes (I) ausgebildet,
- die Treiberstufe (20) weist einen in der kathodenseitigen Basis (16) ausgebildeten und vom kathodenseitigen Emitter (15) getrennten weiteren Emitter (21) des ersten Leitungstyps (n) sowie eine sowohl die kathodenseitige Basis (16) als auch den weiteren Emitter (21) kontaktierende Metallisierung (22) auf,
- ein unterhalb der Metallisierung (22) der wenigstens einen Treiberstufe (20) durch den weiteren Emitter (21), die kathodenseitige Basis (16) und die anodenseitige Basis (17) definierter Transistorverstärkungsfaktor ( $\alpha\, '_{npn}$ ) dieser Treiberstufe (20) ist größer als ein unterhalb der Kathode (13) des Thyristors (1) durch den kathodenseitigen Emitter (15), die kathodenseitige Basis (16) und die anodenseitige Basis (17) definierter Transistorverstärkungsfaktor ( $\alpha_{npn}$ ) des Thyristors (1),

#### und/oder

- ein unterhalb der Metallisierung (22) der wenigstens einen Treiberstufe (20) durch die kathodenseitige Basis (16), die anodenseitige Basis (17) und den anodenseitigen Emitter (18) definierter Transistorverstärkungsfaktor ( $\alpha$ 'pnp) dieser Treiberstufe (20) ist größer als ein unterhalb der Kathode (13)

16

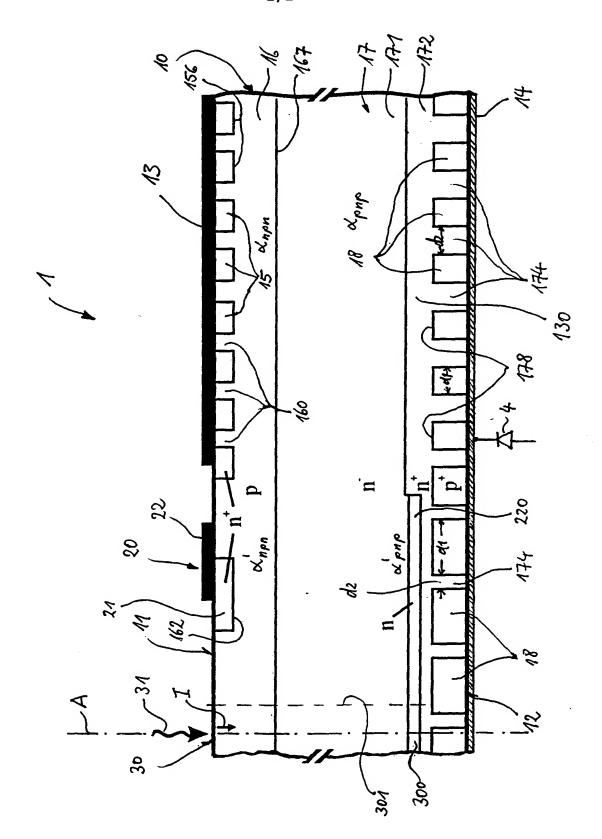
des Thyristors (1) durch die kathodenseitige Basis (16), die anodenseitige Basis (17) und den anodenseitigen Emitter (18) definierter Transistorverstärkungsfaktor ( $\alpha_{\rm pnp}$ ) des Thyristors (1) und/oder

- Anodenkurzschlüsse (174) verbinden die anodenseitige Basis (17) und die Anode (14) miteinander und weisen unterhalb der Metallisierung (22) der wenigstens einen Treiberstufe (20) eine kleinere elektrische Leitfähigkeit als unterhalb der Kathode (13) des Thyristors (1) auf.
- 2. Thyristor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die anodenseitige Basis (17) eine Stoppzone (172) des ersten Leitungstyps (n) aufweist.
- 3. Thyristor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Stoppzone (172) in einem unterhalb der Metallisierung (22) der wenigstens einen Treiberstufe (20) liegenden Bereich (220) schwächer dotiert ist als in einem unterhalb der Kathode (13) des Thyristors (1) liegenden Bereich
  (130).
- 4. Thyristor nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekenn-zeichnet, daß die Stoppzone (172) in dem unterhalb der Metallisierung (22) der wenigstens einen Treiberstufe (20) liegenden Bereich (220) höher dotiert ist als in einem unterhalb einer Stelle (30) zum Einspeisen eines Steuerstroms (I) in die kathodenseitige Basis (16) liegenden Bereich (300).
- 5. Thyristor nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-durch gekennzeichnet, daß die Anodenkurzschlüsse (174) unterhalb der Metallisierung (22) der Treiberstufe (20) einen größeren Abstand (d1) voneinander und/oder einen geringeren Durchmesser (d2) als unterhalb der Kathode (13) des Thyristors (1) aufweisen

17

6. Anordnung aus einem Thyristor (1) nach einem der Ansprüche 2 bis 4 und einer Diode (4), wobei der Thyristor (1) und die Diode (4) elektrisch miteinander verbunden sind.

			<i>i.</i>
			,



		e.
		<b>P</b>
	9	
		,
		v

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inv. stional Application No PCT/DE 00/03351

			ICI/DE 00	7 03331
A. CLASSIF IPC 7	HO1L29/74			
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classifica	tion and IPC		<u>.                                      </u>
B. FIELDS	SEARCHED			
Minimum doo IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classificatio H01L	n symbols)		
Documentati	ion searched other than minimum documentation to the extent that su	uch documents are incl	uded in the fields se	earched
	ata base consulted during the international search (name of data bas ternal, PAJ, INSPEC	e and, where practical	l, search terms used	
C. DOCUME	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	evant passages		Relevant to claim No.
A	WO 98 15010 A (RUFF MARTIN ;EUPEC CO KG (DE); SCHULZE HANS JOACHIM 9 April 1998 (1998-04-09) page 8, line 10 -page 11, line 34 3	(DE))		1-6
A	WO 98 34282 A (SIEMENS AG ;SCHULZ JOACHIM (DE)) 6 August 1998 (1998 cited in the application figure 1	5		
		·/		
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family	members are listed	in annex.
"A" docum consist "E" earlier filling under the citatic citatic "O" docum other "P" docum later the consistence of the citatic "O" docum other "P" docum later the consistence of the co	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the international date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	cited to understar invention  "X" document of partic cannot be consid involve an inventi  "Y" document of partic cannot be consid document is comments, such comments, such comments.  "&" document member	ad not in conflict with not the principle or the cutar relevance; the cered novel or canno- ive step when the do- cutar relevance; the cered to involve an in bined with one or ma- bination being obvious of the same patent	the application but early underlying the claimed invention to econsidered to coument is taken alone claimed invention wentive step when the ore other such docuus to a person skilled
	e actual completion of the international search  19 February 2001	Date of mailing of 27/02/2	f the international se	arcn report
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk TeL (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Authorized officer		

1

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

In. stional Application No
PCT/DE 00/03351

	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	MITLEHNER H ET AL: "HIGH VOLTAGE THYRISTOR FOR HVDC TRANSMISSION AND STATIC VAR COMPENSATORS" PROCEEDINGS OF THE ANNUAL POWER ELECTRONICS SPECIALISTS CONFERENCE. (PESC),US,NEW YORK, IEEE, vol. CONF. 19, 11 April 1988 (1988-04-11), pages 934-939, XP000044744 ISSN: 0275-9306 cited in the application page 934, column 1, paragraph 1	6
A	EP 0 714 139 A (SGS THOMSON MICROELECTRONICS) 29 May 1996 (1996-05-29) figure 6	-

1

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

In: itional Application No PCT/DE 00/03351

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9815010	A 09-04-199	B DE 19650762 A EP 0931351 A JP 2000503816 T	02-07-1998 28-07-1999 28-03-2000
WO 9834282	A 06-08-199	8 EP 0970525 A	12-01-2000
EP 0714139	A 29-05-199	6 FR 2727571 A JP 2813869 B JP 8255895 A US 5861639 A	31-05-1996 22-10-1998 01-10-1996 19-01-1999

		1
		Y
		•

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Int .tionales Aktenzeichen PCT/DE 00/03351

A. KLASSII IPK 7	FIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES H01L29/74				
Nach der Int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	ssifikation und der fPK			
	RCHIERTE GEBIETE				
Recherchier IPK 7	ter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbo HO1L	ole )			
	te aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sc				
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	lame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)		
EPO-In	ternal, PAJ, INSPEC				
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN				
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
A	WO 98 15010 A (RUFF MARTIN ;EUPEC CO KG (DE); SCHULZE HANS JOACHIM 9. April 1998 (1998-04-09) Seite 8, Zeile 10 -Seite 11, Zeil Abbildung 3	(DE))	1-6		
A	WO 98 34282 A (SIEMENS AG ;SCHULZ JOACHIM (DE)) 6. August 1998 (199 in der Anmeldung erwähnt Abbildung 1	5			
	·	-/			
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie			
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</li> <li>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedat oder dem Prioritätsdatum veröffentlich worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegene Theorie angegeben ist</li> <li>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren andere Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren andere Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin van nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren andere Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin van nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfin van nicht als</li></ul>					
	Abschlusses der internationalen Recherche 9. Februar 2001	Absendedatum des internationalen Re 27/02/2001	cherchenberichts		
<b></b>	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter			
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Juhl, A			

1





Int dionales Aktenzeichen PCT/DE 00/03351

C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden	Teile Betr. Anspruch Nr.
A	MITLEHNER H ET AL: "HIGH VOLTAGE THYRISTOR FOR HVDC TRANSMISSION AND STATIC VAR COMPENSATORS" PROCEEDINGS OF THE ANNUAL POWER ELECTRONICS SPECIALISTS CONFERENCE. (PESC),US,NEW YORK, IEEE, Bd. CONF. 19, 11. April 1988 (1988-04-11), Seiten 934-939, XP000044744 ISSN: 0275-9306 in der Anmeldung erwähnt Seite 934, Spalte 1, Absatz 1	6
A	EP 0 714 139 A (SGS THOMSON MICROELECTRONICS) 29. Mai 1996 (1996-05-29) Abbildung 6	5

1

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Ini lionales Aktenzeichen PCT/DE 00/03351

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Mitglied(er) de Veröffentlichung Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung		
WO	9815010	Α	09-04-1998	DE EP JP	19650762 0931351 2000503816	Α	02-07-1998 28-07-1999 28-03-2000
WO	9834282	Α	06-08-1998	EP	0970525	Α	12-01-2000
EP	0714139	Α	29-05-1996	FR JP JP US	2727571 2813869 8255895 5861639	B A	31-05-1996 22-10-1998 01-10-1996 19-01-1999

		í	
			•
			}-
	*		
			,